

<p style="text-align: center;">Historie zur Forschung von Prof. Koch auf dem Gebiet der Dünnschichtmesstechnik</p>	
1988 - 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erste Untersuchungen von Dr.-Ing. Alexander W. Koch zur Dünnschichtmesstechnik am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching.</li> </ul>
1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr.-Ing. Alexander W. Koch wird auf die Professur für Messtechnik der Universität des Saarlandes berufen und forscht weiterhin auch auf dem Gebiet der Dünnschichtmesstechnik.</li> </ul>
1996 - 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Promotion von Qilong Feng mit dem Thema „Laser Based Interferometric Remote Measuring Technique for the Determination of Film Thicknesses and Film Properties“.</li> </ul>
1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prof. Alexander W. Koch wird auf die Professur für Messsystem- und Sensortechnik (MST) der Technischen Universität München (TUM) berufen und forscht weiterhin auch auf dem Gebiet der Dünnschichtmesstechnik.</li> </ul>
2007 - 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forschungsprojekt „Optische Messtechnik“ im Verbundvorhaben „Grundlagen für die nächste Generation X gedruckter Elektronik durch vernetzte Entwicklung von Materialien, Bauelement-Analyse und Druckprozessen – MaDriX“, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).</li> <li>- Durchführung der Promotion von Florian Hirth mit dem Thema „Schichtdickenmessung an gedruckten Polymerschichtsystemen“.</li> </ul>
2013 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forschungsprojekt „Hyperspektrales chromatisches Reflektometer zur Vermessung bewegter Objekte“, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).</li> <li>- Durchführung der Promotion von Anton Tremmel.</li> </ul>
2017 - 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Promotion von Xingchen Dong mit dem Thema „Hyperspectral Imaging“.</li> </ul>

Stand Februar 2019